

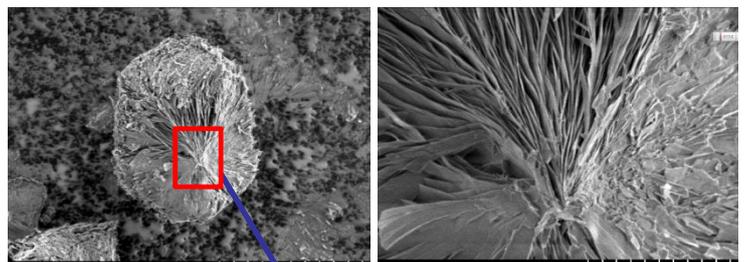
# 低加速走査型電子顕微鏡



|       |   |
|-------|---|
| 機器名   | 低加速走査型電子顕微鏡(SEM用マイクロアナライザ付き)[SEM-EDS]   |
| メーカー名 | 株式会社日立ハイテクノロジーズ   |
| 型式    | SU3500  |
| 取得年月  | 2014/1 公益財団法人JKA競輪補助  |
| 用途    | 材料表面の微細構造観察および元素分析  |
| 仕様    | 倍率：10～30万倍(実用倍率：2万倍、試料により大きくかわります)<br>低真空モード10～650Pa設定可能、反射電子像、2次電子像<br>元素分析可Be～U<br>低加速電圧で従来より高解像度で観察できることが特徴です。 |

## 用途・使用例

微小サンプルの観察・元素分析、  
低加速電圧での観察が可能  
反射電子像、2次電子像の観察



## 注意点

油・水等の揮発物質は必ず除去して下さい。  
必要に応じて導電性処理を行うことがあります。

